-44-

УДК 544.015.3

Смітюх О.В.<sup>1</sup>, асп.; Марчук О.В.<sup>1</sup>, к.х.н., доц.; Олексеюк І.Д.<sup>1</sup>, д.х.н., проф.; Федорчук А.О.<sup>2</sup>, д.х.н., проф.

# КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУК Er1.5La(Pr)1.5Si1.67Se7

<sup>1</sup>Кафедра неорганічної та фізичної хімії, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, пр. Волі 13, 43025 м. Луцьк, Україна;
<sup>2</sup>Кафедра неорганічної та органічної хімії, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, вул. Пекарська, 50, 79010 м. Львів, Україна e-mail: Marchuk.Oleg@eenu.edu.ua

#### ВСТУП

Одним із пріоритетних завдань неорганічного напівпровідникового матеріалознавства є одержання нових речовин із широким спектром властивостей. Вивчення кристалічних структур сполук, до складу яких входять рідкісноземельні метали є перспективним з огляду на те, що вони проявляють напівпровідникові властивості, а також є термічно стійкими. Крім того, сполуки такого складу володіють електричними та магнітними властивостями [1].

Представлена робота є одним із етапів систематичного дослідження квазіпотрійних систем  $SiSe_2 - R_2Se_3 - R'_2Se_3$  (R, R' – P3M [2-5] і ін.). Завданням дослідження є отримання складних РЗМ-вмісних халькогенідів з метою пошуку перспективних матеріалів з наперед заданими функціональними властивостями.

#### ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

Наважки зразків для дослідження були підготовлені з високочистих компонентів у кварцевих ампулах. Синтез сплавів проводили у вакуумованих контейнерах в електричній муфельній печі з програмним управлінням технологічними процесами МП-30 згідно наступного режиму: нагрів до температури 1150°С із швидкістю 12°С/год; витримка за температури 1150°С протягом 4 годин; охолодження до температури 500°С із швидкістю 12°С/год; гомогенізуючий відпал за температури 500°С протягом 500 годин; гартування у воду кімнатної температури.

Порошкограми з рентгенівськими відбиттями отримували на дифрактометрі DRON 4-13 (СиК $\alpha$  - випромінення,  $10^{\circ} \le 2\theta \le 100^{\circ}$ , крок зйомки 0.05°, експозиція у кожній точці 20 с). Обрахунок кристалічної структури проводили за допомогою пакету програм CSD [6].

### РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Кристалічна структура сполук Er<sub>1.5</sub>La<sub>1.5</sub>Si<sub>1.67</sub>Se<sub>7</sub> та Er<sub>1.5</sub>Pr<sub>1.5</sub>Si<sub>1.67</sub>Se<sub>7</sub> вивчалася рентгенівським методом порошку. Дифрактограми відповідних складів були проіндексовані в гексагональній сингонії (ПГ Р63). Умови рентгенівського експерименту та кристалографічні параметри тетрарних сполук наведені у табл. 1. На рис. 1 та 2 представлені експериментальні і теоретичні дифрактограми сполук Er<sub>1.5</sub>La<sub>1.5</sub>Si<sub>1.67</sub>Se<sub>7</sub> та Er<sub>1.5</sub>Pr<sub>1.5</sub>Si<sub>1.67</sub>Se<sub>7</sub> та різницеві між ними. В табл. 2 подано уточнені координати та параметри зміщення атомів у структурах сполук Er<sub>1.5</sub>La<sub>1.5</sub>Si<sub>1.67</sub>Se<sub>7</sub> i Er<sub>1.5</sub>Pr<sub>1.5</sub>Si<sub>1.67</sub>Se<sub>7</sub>.

У структурі тетрарної фази Er<sup>3+</sup>1.5La<sup>3+</sup>1.5Si<sup>4+</sup>0.67Si<sup>2+</sup>Se<sup>2-</sup>7 ПСТ 6с заселяли статистичною сумішшю із атомів Er і La. Координаційне оточення катіонів наступне: R1\* (Er + La) центрований в тригональній призмі з двома додатковими атомами  $[R_1(Er + La)4Se_13Se_21Se_3]$ (рис. 3); Si(II) скоординований в октаедрі [Si(II)6Se<sub>1</sub>], а атом Si(IV) має тетраедричне оточення із атомів Селену: [Si(IV)3Se<sub>2</sub>1Se<sub>3</sub>]. Довжини зв'язків R – Se є адитивними величинами, оскільки атоми Er i La перебувають у статистичному розподілі.

-45-

Параметри	$Er_{1.5}La_{1.5}Si_{1.67}Se_7$	Er <sub>1.5</sub> Pr <sub>1.5</sub> Si <sub>1.67</sub> Se <sub>7</sub>
Число формульних одиниць (Z)	2	2
Просторова група	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> (no. 173)	<i>P</i> 6 <sub>3</sub> (no. 173)
а, (нм)	1.05890(4)	1.04790(3)
С, (НМ)	0.59952(3)	0.59735(2)
Об'єм комірки (нм <sup>3</sup> )	0.58216(6)	0.56807(5)
Кількість атомів в комірці	23.3	23.3
Густина (обрахована) (г/см <sup>3</sup> )	6.0402(7)	6.2075(5)
Адсорбційний коефіцієнт (1/см)	901.406	956.99
Випромінювання і довжина хвилі (нм)	Cu 0.154185	Cu 0.154185
Дифрактометр	ДРОН-4-13	ДРОН-4-13
Спосіб обрахунку	Повнопрофільний	Повнопрофільний
Програма для обрахунку	CSD	CSD
Кількість атомних позицій	6	6
Кількість вільних параметрів	17	13
$2\Theta$ та sin $\Theta/\lambda$ (макс.)	100.02; 0.497	100.02; 0.497
$R_I$	0.0552	0.0447
R <sub>P</sub>	0.1703	0.1549
Фактор шкали	0.2300(1)	0.17602(0)
Вісь текстури і параметр	[111] 1.2(2)	[111] 1.2(2)

Таблиця 1. Кристалохімічні параметри сполук Er<sub>1.5</sub>La<sub>1.5</sub>Si<sub>1.67</sub>Se<sub>7</sub> та Er<sub>1.5</sub>Pr<sub>1.5</sub>Si<sub>1.67</sub>Se<sub>7</sub>



**Рис. 1.** Теоретична та експериментальна дифрактограми сполуки Er<sub>1.5</sub>La<sub>1.5</sub>Si<sub>1.67</sub>Se<sub>7</sub> та їх різницева.



**Рис. 2.** Теоретична та експериментальна дифрактограми сполуки Er<sub>1.5</sub>Pr<sub>1.5</sub>Si<sub>1.67</sub>Se<sub>7</sub> та їх різницева.

-46-

$Er_{1.5}La_{1.5}Si_{1.67}Se_7$							
Атоми	ПСТ	x/a	y/b	z/c	$B_{i30} \times 10^2  (\text{HM}^2)$		
R1*	6( <i>c</i> )	0.1297(2)	0.3587(2)	0.0434(5)	1.19(4)		
Si1	2( <i>b</i> )	1/3	2/3	0.599(2)	0.6(4)		
Si2	2( <i>a</i> )	0	0	-0.262(3)	0.9(3)		
Se1	6( <i>c</i> )	0.2587(2)	0.1645(3)	0.042(7)	0.40(10)		
Se2	6( <i>c</i> )	0.5216(3)	0.1087(3)	0.2673(5)	0.34(10)		
Se3	2( <i>b</i> )	1/3	2/3	0.2511(8)	0.52(9)		
$Er_{1.5}Pr_{1.5}Si_{1.67}Se_7$							
Атоми	ПСТ	x/a	y/b	z/c	$B_{i_{30}} \times 10^2  (\text{Hm}^2)$		
R1**	6( <i>c</i> )	0.1293(1)	0.3581(1)	0.0309(5)	1.047(2)		
Si1	2( <i>b</i> )	1/3	2/3	0.616(3)	1.102(4)		
Si2	2(a)	0	0	0.737(3)	0.461(3)		
Se1	2( <i>b</i> )	1/3	2/3	0.2489(8)	0.695(7)		
Se2	6( <i>c</i> )	0.2571(2)	0.1623(2)	0.0071(6)	1.080(9)		
Se3	6( <i>c</i> )	0.5224(3)	0.1067(3)	0.2665(5)	1.002(10)		
* R1 – 0.5 Er + 0.5 La; Si1 – 0.67 Si ** R1 – 0.5 Er + 0.5 Pr; Si1 – 0.67 Si							

<b>Таблиця 2.</b> Параметри атомів для сполук Er <sub>1.5</sub> La <sub>1.5</sub> Si <sub>1.67</sub> Se <sub>7</sub> та Er <sub>1.5</sub> .	$r_{1.5}Si_{1.5}$	.67Se7
---	-------------------	--------



**Рис. 3.** Елементарна комірка сполуки  $Er^{3+}_{1.5}La^{3+}_{1.5}Si^{4+}_{0.67}Si^{2+}Se^{2-}_{7}$  та відстані між атомами в координаційних многогранниках для атомів Si(IV), Si(II) та R(Er + La).



**Рис. 4.** Елементарна комірка сполуки  $Er^{3+}_{1.5}Pr^{3+}_{1.5}Si^{4+}_{0.67}Si^{2+}Se^{2-}_{7}$  та відстані між атомами в координаційних многогранниках для атомів Si(IV), Si(II) та R(Er + Pr).

У структурі тетрарної сполуки  $Er^{3+}_{1.5}Pr^{3+}_{1.5}Si^{4+}_{0.67}Si^{2+}Se^{2-}_{7}$  ПСТ *6с* також заселена сумішшю атомів Ег і Рг. ПСТ *6с* фіксувалася при розрахунках із метою збереження електронейтральності сполуки, а

також це стабілізувало теплові та анізотропні параметри. Координаційне оточення атомів наступне:  $R1^{**}(Er + Pr)$  центрований в тригональній призмі з двома додатковими атомами  $[R_1(Er + Pr)4Se_23Se_31Se_1]$  (рис. 4); Si(II) скоординований в октаедрі [M<sub>1</sub>6Se<sub>2</sub>], а атом Si(IV) має тетраедричне оточення із атомів Селену: [Si(IV)3Se<sub>3</sub>1Se<sub>1</sub>]. Заміна атома La на Pr призводить до зменшення параметрів елементарної комірки, що пояснюється зменшенням радіусу атома при переході від La до Pr.

#### ВИСНОВКИ

Рентгенівським методом порошку вперше вивчено кристалічну структуру нових Тетрарні тетрарних сполук. сполуки  $Er_{1.5}La_{1.5}Si_{1.67}Se_7$  $Er_{1.5}Pr_{1.5}Si_{1.67}Se_7.$ та кристалізуються у гексагональній сингонії (ПГ *P*6<sub>3</sub>) з параметрами елементарних комірок: *a* = 1.05890(4) нм і *c* = 0.59952(3) нм та a = 1.04790(3) нм і c = 0.59735(2) нм. Вивчення кристалічної структури сполук Er<sub>1.5</sub>La<sub>1.5</sub>Si<sub>1.67</sub>Se<sub>7</sub> та Er<sub>1.5</sub>Pr<sub>1.5</sub>Si<sub>1.67</sub>Se<sub>7</sub> має перспективу, що пов'язана із статистичним розподілом у їх структурі двох типів атомів Si(II) та Si (IV). У перспективі плануються дослідження електричних та магнітних властивостей отриманих тетрарних сполук.

#### Список використаних джерел

1. Daszkiewicz M., Pashynska Yu., Marchuk O., Gulay L. Crystal structure of  $R_3Co_{0.5}GeS_7$  (r = rare earth). *C. A.* 55<sup>st</sup> P. Cryst. M. 27-29 June, 2013, Wroclaw, Poland. 2013, A. 47.

2. Смітюх О.В., Савчук Р.М., Марчук О.В., Олексеюк І.Д., Федорчук А.О. Кристалічна структура сполуки Y<sup>3+</sup>1.5Pr<sup>3+</sup>1.5Si<sup>4+</sup>0.75Si<sup>2+</sup>Se<sup>2-</sup>7. Збірник тез доповідей XVIII Наук. молод. конф. «Проблеми та досягнення сучасної хімії» 17–20 травня 2016 року, м. Одеса, ТОВ НВІП "Інтерсервіс", м. Київ. 2016. С. 132.

3. Смітюх О.В., Савчук Р.М., Марчук О.В., Олексеюк І.Д. Система SiSe<sub>2</sub> – Er<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> – Pr<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>. Збірник тез доповідей XIX Наук. молод. конф. «Проблеми та досягнення сучасної хімії» 26–28 квітня 2017 року, м. Одеса. 2017. С. 104.

4. Смітюх О.В., Марчук О.В., Олексеюк І.Д., Федорчук А.О. Кристалічна структура сполук Y<sub>1.5</sub>Pr<sub>1.5</sub>Si<sub>1.75</sub>Se<sub>7</sub> та Dy<sub>1.5</sub>La<sub>1.5</sub>Si<sub>1.66</sub>Se<sub>7</sub>. *Науковий* вісник Ужгородського ун-ту. Серія «Хімія». 2016, 2(36), 18–21.

5. Akselrud L., Grin Y. Software package for crystallographic calculations (Version 4). *J. Appl. Cryst.* 2014, 47, 803–805.

Стаття надійшла до редакції: 20.05.2017.

## THE CRYSTAL STRUCTURE OF Er1.5La(Pr)1.5Si1.67Se7 COMPOUNDS

#### Smitiukh O.V., Marchuk O.V., Olekseyuk I.D., Fedorchuk A.O.

The existence of new quaternary compounds  $\text{Er}_{1.5}\text{La}_{1.5}\text{Si}_{1.67}\text{Se}_7$  (space group *P*6<sub>3</sub>, Pearson code *hP*23, a = 10.5890(4) Å, c = 5.9952(3) Å, *R<sub>I</sub>* = 0.0552) Ta  $\text{Er}_{1.5}\text{Pr}_{1.5}\text{Si}_{1.67}\text{Se}_7$  (space group *P*6<sub>3</sub>, Pearson code *hP*23, a = 10.4790(3) Å, c = 5.9735(2) Å, *R<sub>I</sub>* = 0.0447). The method of powder studied their crystal structure. Atoms R\*(Er+La) and R\*\*(Er+Pr) located in trigonal prisms with two additional atoms, Si<sup>II</sup> localized in the octahedron, and the atoms Si<sup>IV</sup> are localized in tetrahedrons.